SPANS 8

# 『SPring-8産業利用の現状』

高輝度光科学研究センター 廣沢一郎 産業利用推進室

D 1 7000 11 4



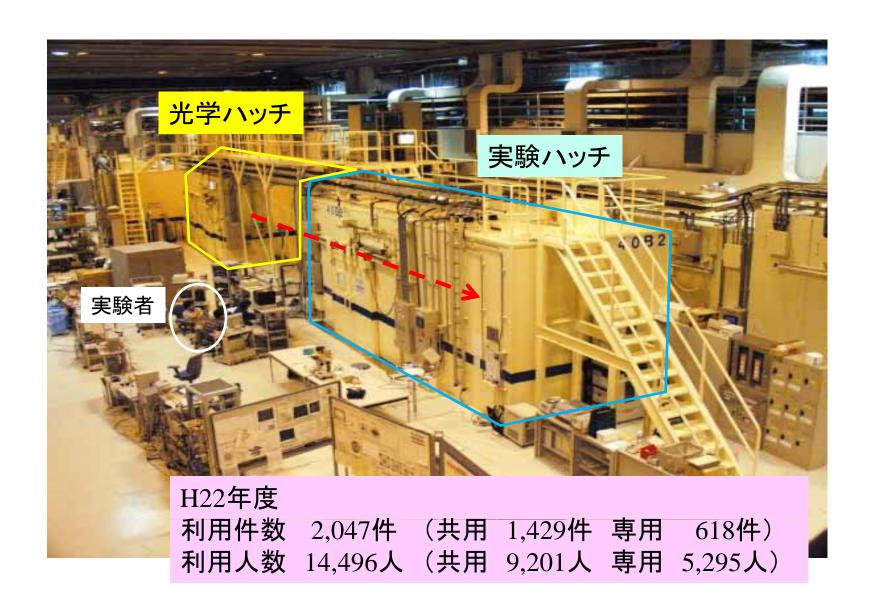
### SPring-8とは

### 高エネルギー & 高輝度なX線光源





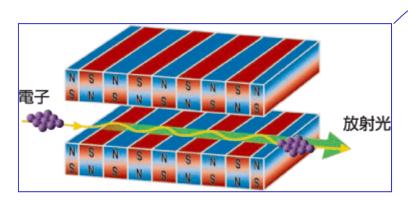
### 実験ホール



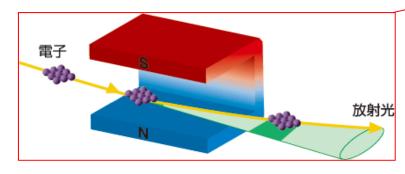


# SPring-8の放射光の特徴

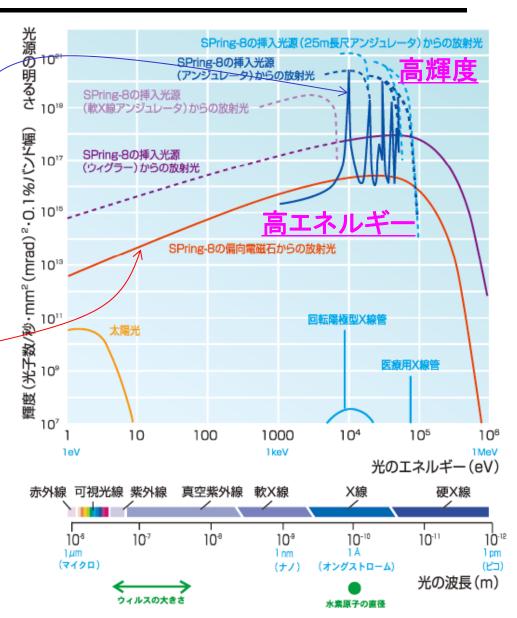
### 高エネルギー & 高輝度



アンジュレーター



偏向電磁石





## 高輝度X線の利用例

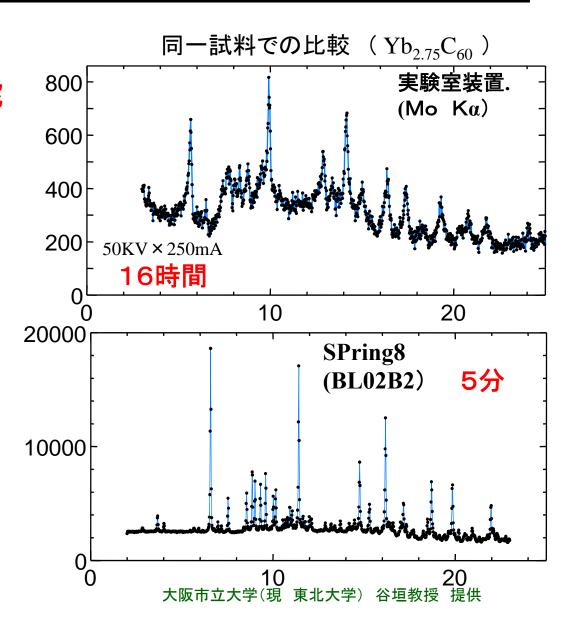
#### 高分解能粉末X線回折

### 短時間で高精度の 粉末X線回折が可能

異常分散効果により 元素選択性が向上

自動試料交換装置による高能率測定

BL19B2 **測定代行実施中** 





沸騰水型軽水炉

# 『一〇』原子炉隔壁ピーニング処理部の応力

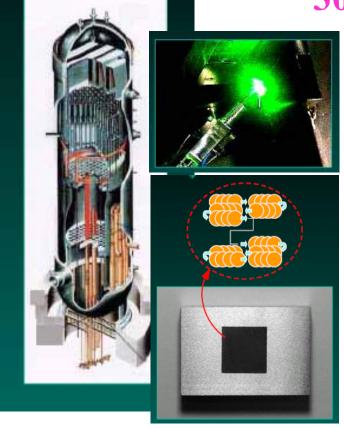
#### 高エネルギーX線の利用

#### 高エネルギーX線の透過性を利用して深部の知見を得る

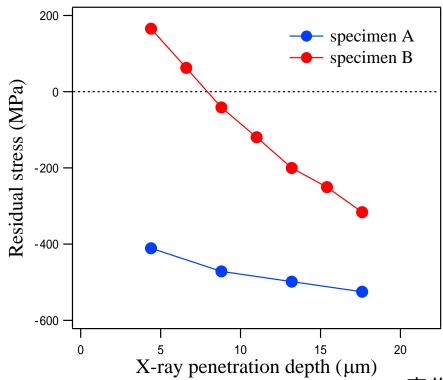
侵入深さ 6.5µm (8keV)

 $220\mu m$  (30keV)

30keVでのX線回折 (BL19B2)



#### 処理方法による残留応力深さ分布の違い



東芝 佐野氏

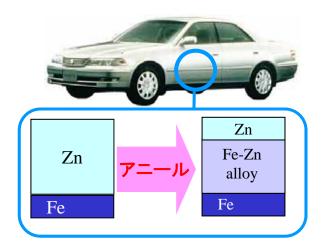


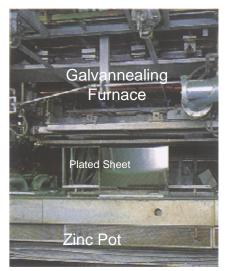
## めっき合金化工程の時分割測定

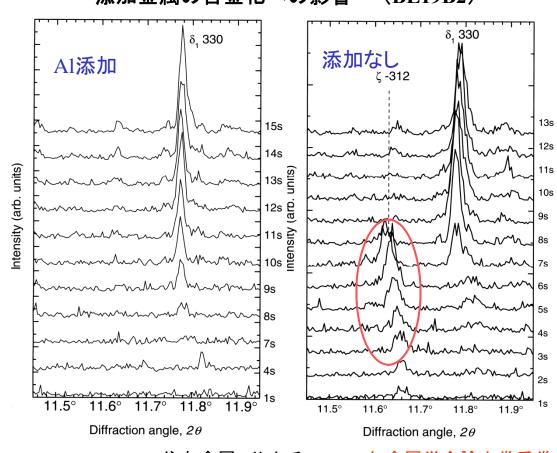
### 高エネルギー(高輝度)の利用

#### X線回折によるその場観察(時分割)測定

添加金属の合金化への影響 (BL19B2)







住友金属 谷山氏 2005年金属学会論文賞受賞

他にアーク溶接の凝固過程時分割測定(10msec)など



### 酸窒化膜のX線反射率測定 高輝度光の利用

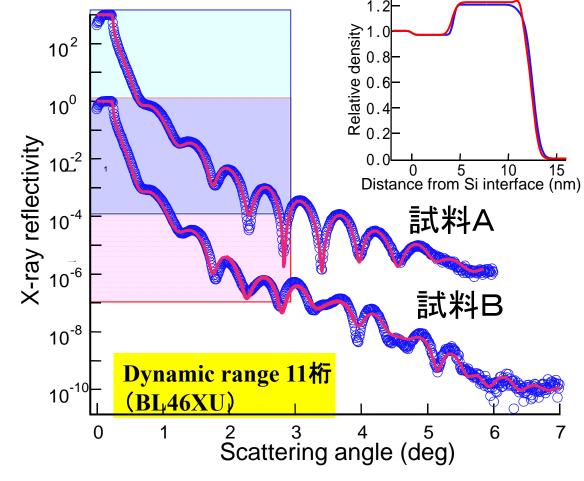
#### 特性の異なるCVDで形成したLSI用酸窒化膜の評価

自然酸化膜(1nm)

窒化膜(8nm)

酸化膜(5nm)

Si 基板



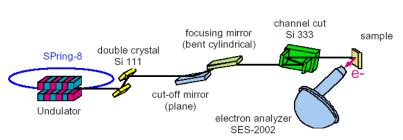
Z.Liu et al., Appl. Phys. Lett. 92, 192115 (2008)

ルネサステクノロジー 劉氏

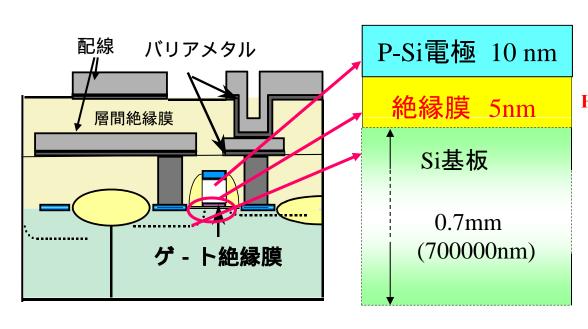


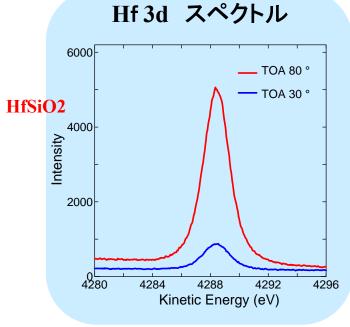
### LSIゲート絶縁膜界面評価

### 高エネルギー光電子分光: 高輝度硬X線の活用



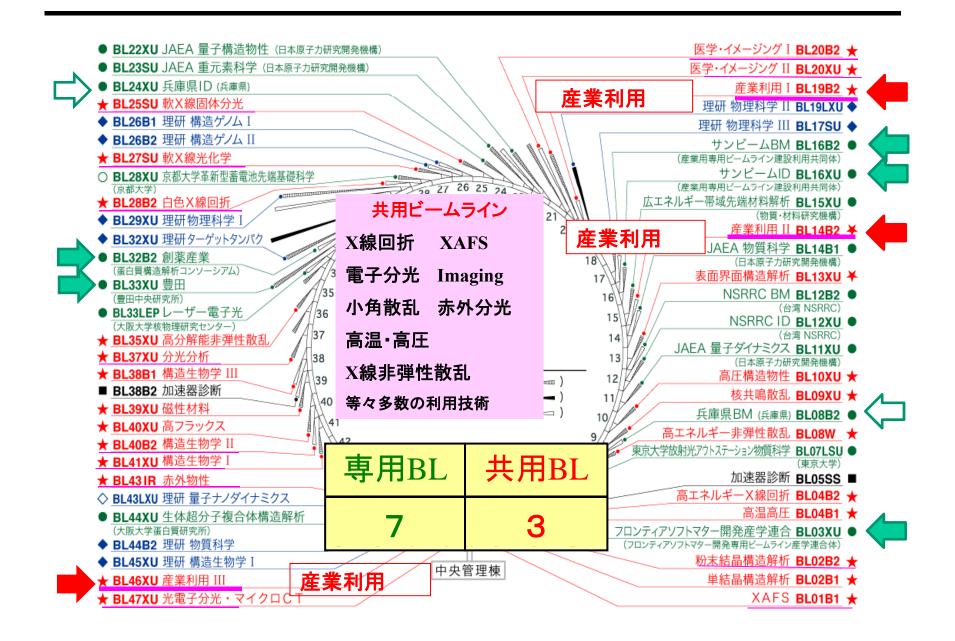








## 民間企業の利用が多いBL





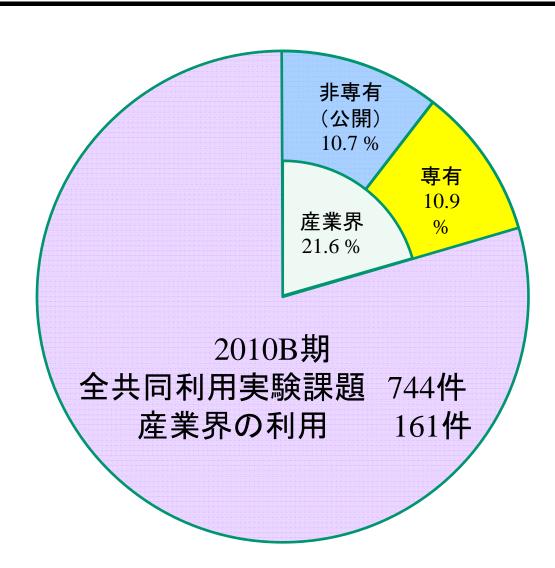
# 共用ビームラインの利用制度

	成果非専有 (成果公開)	成果専有 (成果非公開)
課題種	一般課題 重点産業化促進課題	一般課題
期待する利用目的	産業基盤技術の構築 放射光利用技術の検討	各社固有の技術課題解決
課題審査	有	無 (安全・技術審査のみ)
利用料	免除	48万・72万 円/シフト

共用ビームライン:一定の審査のもと、誰でも利用可能



# サインでの産業利用の割合 サインでの産業利用の割合



産業界は約半数が専有(有料)で利用



### SPring-8の産業利用分野



幅広い産業分野で活用中、斬新な利用提案を歓迎



### 共用BL利用者の特徴

柔軟性

→ <mark>容易な操作</mark>
→ <mark>高能率な測定</mark>

### 測定自動化

容易な操作と能率向上を実現

アクセサリーの整備 拡張性・柔軟性のある開発環境(SPEC採用)

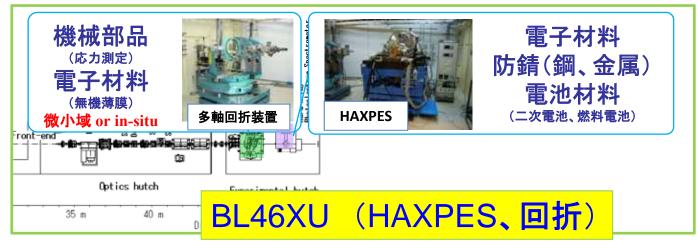


# 多様な利用技術

#### 広範な利用分野、多様な利用技術への対応を目指して





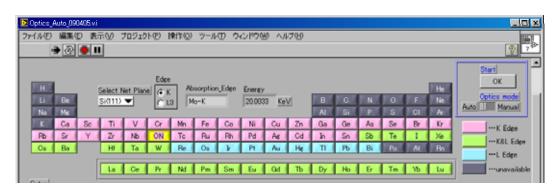




### 測定自動化

#### **BL14B2**

### 透過XAFS測定の完全自動化



### 光学機器調整の自動化 能率向上約2倍

モノクロ結晶調整、ミラー角度調整、ガス交換、アンプゲイン最適化調整、スリット開口最適化調整を自動で行う

### 試料交換の自動化 能率向上1.3倍

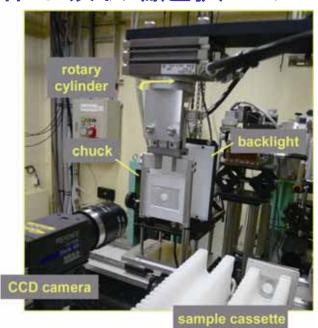
試料交換と位置決めを自動で実施 不規則形状試料にも対応可能

最大80個まで自動測定可能 45°配置蛍光法にも対応



Award 2010 NI Application Contest

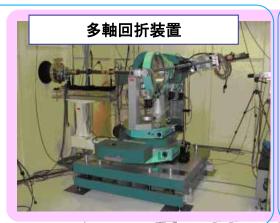
#### 操作は吸収端選択のみ





# 自動化・カスタマイス BL19B2

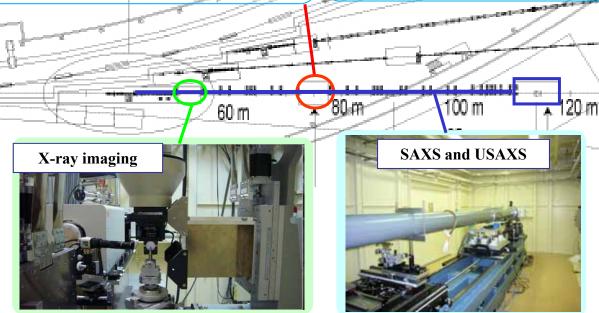
GIXD XRR 自動試料 位置調整





試料自動交換 自動位置調整

> 能率向上 約10倍

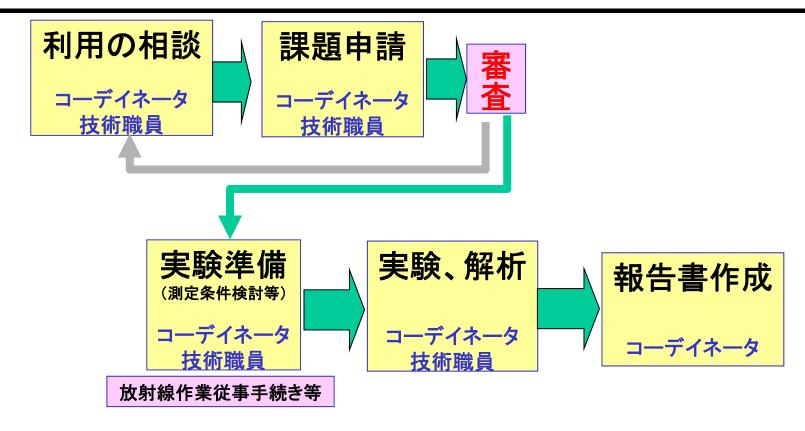


測定内容に応じたマクロコマンド提供 (2種のコマンドで可能な測定も)

BL46XUも同様



# SPring-8ご利用までの流れ



年4回募集 次回(H24年 6-7月利用)は3月募集予定 WEBにご注目ください

http://www.spring8.or.jp/ja/users/proposals/call\_for/



### 測定代行

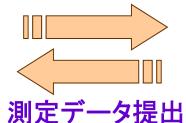
#### JASRI産業利用推進室職員がユーザーに代わって測定を行う

随時受付

2時間単位の利用

サンプル送付

ユーザー



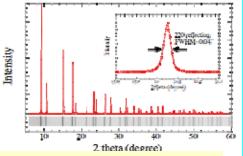


XAFS (BL14B2) daikou14@spring8.or.jp

粉末X線回折(BL19B2) daikou19@spring8.or.jp

#### BL19B2 粉末X線回折





全自動試料交換・粉末回折測定システム

試料交換等に要する時間:45秒 最大100個のサンプルを装填可能

#### BL14B2 XAFS

透過法







転換全電子収量法



#### 全自動試料交換システム (透過法)

試料交換等に要する時間:約40秒 最大80個のサンプルを連続測定可能

# 皆様のご利用を お待ちしております

JASRI 產業利用推進室

support@spring8.or.jp 0791-58-0924

お気軽にお問い合わせください